

Docket No.: 67161-129

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of	:	Customer Number: 20277
	:	
Mitsuya KINOSHITA, et al.	:	Confirmation Number:
	:	
Serial No.:	:	Group Art Unit:
	:	
Filed: November 14, 2003	:	Examiner: Unknown
	:	
For:		SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE HAVING SELF-PRECHARGE FUNCTION

**CLAIM OF PRIORITY AND
TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT**

Mail Stop CPD
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

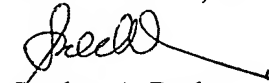
In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. 2003-022312, filed January 30, 2003

cited in the Declaration of the present application. A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY


Stephen A. Becker
Registration No. 26,527

600 13th Street, N.W.
Washington, DC 20005-3096
(202) 756-8000 SAB:tlb
Facsimile: (202) 756-8087
Date: November 14, 2003

67161-129
KINOSHITA
November 14, 2003

日 本 国 特 許 庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2003年 1月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2003-022312

[ST.10/C]:

[JP2003-022312]

出 願 人

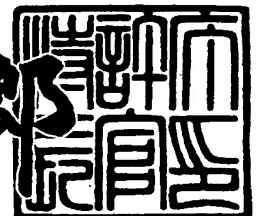
Applicant(s):

三菱電機株式会社

2003年 2月25日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3010908

【書類名】 特許願

【整理番号】 541896JP01

【提出日】 平成15年 1月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11C 11/409

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 木下 充矢

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 野田 英行

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064746

【弁理士】

【氏名又は名称】 深見 久郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100085132

【弁理士】

【氏名又は名称】 森田 俊雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100083703

【弁理士】

【氏名又は名称】 仲村 義平

【選任した代理人】

【識別番号】 100096781

【弁理士】

【氏名又は名称】 堀井 豊

【選任した代理人】

【識別番号】 100098316

【弁理士】

【氏名又は名称】 野田 久登

【選任した代理人】

【識別番号】 100109162

【弁理士】

【氏名又は名称】 酒井 將行

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008693

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体記憶装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 行列状に配置される複数のメモリセル、前記複数のメモリセルの複数の行にそれぞれ対応して配置される複数のワード線、および前記複数のメモリセルの複数の列にそれぞれ対応して配置される複数のビット線対を各々に含む複数のメモリブロックと、

前記複数のメモリブロックの各々に対応して設けられ、前記メモリセルから読み出されたデータを検知増幅する複数のセンスアンプ帯と、

前記複数のセンスアンプ帯の各々から共通に引き出された複数の読出しデータ線対と、

前記複数の読出しデータ線対の中の 1 対の読出しデータ線対が入力端子に接続された論理回路とを備え、

前記論理回路は、入力端子に接続された 1 対の読出しデータ線対の電位差が開いたときにセルフプリチャージ信号を出力する、半導体記憶装置。

【請求項 2】 前記複数のセンスアンプ帯の各々は、前記複数のビット線対の各々に対応して設けられ、前記読出しデータ線対へデータを読み出すための読出しゲート回路を含み、

前記読出しゲート回路は、

ゲートが前記ビット線対の一方に接続され、ソースが前記センスアンプの活性／非活性に応じて動的に変化する第 1 のトランジスタと、

ゲートが前記ビット線対の他方に接続され、ソースが前記センスアンプの活性／非活性に応じて動的に変化する第 2 のトランジスタとを有する、請求項 1 に記載の半導体記憶装置。

【請求項 3】 前記セルフプリチャージ信号または外部プリチャージ信号のいずれかが入力されたときに内部プリチャージ信号を出力する中央制御回路をさらに備える、請求項 1 または 2 に記載の半導体記憶装置。

【請求項 4】 前記複数のセンスアンプ帯の各々は、前記セルフプリチャージ信号をもとに生成されたプリアンプ活性化信号が活性化されたときに前記読出

しデータ線対から読み出されたデータを増幅するプリアンプを含む、請求項 1 または 2 に記載の半導体記憶装置。

【請求項 5】 前記論理回路の入力端子に接続される 1 対の読出しデータ線対は、前記複数のセンスアンプ帯のいずれかから前記論理回路の入力端子までの距離が最長となる読出しデータ線対とは異なる読出しデータ線対である、請求項 1 または 2 に記載の半導体記憶装置。

【請求項 6】 前記論理回路の入力端子に接続される 1 対の読出しデータ線対は、前記複数のセンスアンプ帯のいずれかから前記論理回路の入力端子までの距離が最短となる読出しデータ線対である、請求項 5 に記載の半導体記憶装置。

【請求項 7】 前記複数の読出しデータ線対の中から 1 対の読出しデータ線対を選択して前記論理回路の入力端子に接続する入出力選択回路をさらに備える、請求項 1 または 2 に記載の半導体記憶装置。

【請求項 8】 前記複数の読出しデータ線対のうち、前記論理回路の入力端子に接続される 1 対の読出しデータ線対は読出し時および書込み時に読出しデータを読み出せるようにし、前記論理回路の入力端子に接続される 1 対の読出しデータ線対とは異なる読出しデータ線対は読出し時専用とする、請求項 1、2、5 および 7 のいずれかに記載の半導体記憶装置。

【請求項 9】 前記論理回路は X O R 回路である、請求項 1、2、5、7 および 8 のいずれかに記載の半導体記憶装置。

【請求項 1 0】 前記論理回路は N A N D 回路である、請求項 1、2、5、7 および 8 のいずれかに記載の半導体記憶装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体記憶装置に関し、より特定的には、D R A M (Dynamic Random Access Memory) のようなプリチャージ動作を行なう半導体記憶装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来技術】

従来の半導体記憶装置は、プリチャージ動作を行なわせるための専用の外部制御信号線を付加し、コマンドによらず、その外部制御信号線からの外部制御信号の入力により、強制的にプリチャージを実行できるようにすることで、メモリサイクル時間を短縮できる（たとえば、特許文献 1 参照）。

【 0 0 0 3 】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 0 - 2 0 7 8 8 3 号公報

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

従来の半導体記憶装置は、専用の外部制御信号線からの外部制御信号の入力によって強制的なプリチャージを実行するため、新たな外部信号線および外部制御が必要になるという問題があった。

【 0 0 0 5 】

それゆえに、この発明の目的は、新たな外部信号線および外部制御を必要とせずにメモリ動作の高速化が可能な半導体記憶装置を提供することである。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

この発明による半導体記憶装置は、行列状に配置される複数のメモリセル、複数のメモリセルの複数の行にそれぞれ対応して配置される複数のワード線、および複数のメモリセルの複数の列にそれぞれ対応して配置される複数のビット線対を各々に含む複数のメモリブロックと、複数のメモリブロックの各々に対応して設けられ、メモリセルから読み出されたデータを検知増幅する複数のセンスアンプ帯と、複数のセンスアンプ帯の各々から共通に引き出された複数の読出しデータ線対と、複数の読出しデータ線対の中の 1 対の読出しデータ線対が入力端子に接続された論理回路とを備え、論理回路は、入力端子に接続された 1 対の読出しデータ線対の電位差が開いたときにセルフプリチャージ信号を出力する。

【 0 0 0 7 】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、

図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。

【0008】

〔実施の形態1〕

図1は、この発明の実施の形態1による半導体記憶装置1Aの全体構成を示した概略ブロック図である。

【0009】

図1に示した実施の形態1の半導体記憶装置1Aは、中央制御回路2Aと、ロウデコーダ3と、センスアンプ帯4.1A, 4.2A, 4.3Aと、メモリブロック5.1, 5.2, 5.3と、XORゲート6とを備える。

【0010】

中央制御回路2Aは、コマンドを示す制御信号 $extACT$, $extPRE$, $extSREF$, $extREAD$ 、クロック信号 $extCLK$ 、およびロウアドレス信号 $extRA$ を外部から受けて、内部制御信号 ACT , RXT , RAL , $SELFREF$, $READ$, PAE 、およびアドレス信号 $XO<1:0>$, $XN<3:0>$, $XM<3:0>$, $XSD<3:0>$, $RA<7:2>$ をロウデコーダ3に出力する。この中央制御回路2Aの具体的構成については、後に詳述する。

【0011】

ロウデコーダ3は、中央制御回路2Aから与えられた各種信号を受けて、センスアンプ帯4.1A, 4.2A, 4.3Aおよびメモリブロック5.1, 5.2, 5.3に対してロウ系のデコード処理を行なう。

【0012】

センスアンプ帯4.1A, 4.2A, 4.3Aからは、センスアンプ帯4.1A, 4.2A, 4.3Aに共通の読出しデータ線対 $GIOR$, $\neg GIOR$ が引き出され、XORゲート6の入力端子に接続される。XORゲート6は、データ線対 $GIOR$, $\neg GIOR$ の電位差が開いたときに、中央制御回路2に対してセルフプリチャージ信号 $SELFPRE$ を出力する。

【0013】

図1では、XORゲートに接続された1対の読出しデータ線対 $GIOR$, $\neg G$

I O R を代表して示しているが、実際には複数の読出しデータ線対がセンスアンプ帯 4. 1 A, 4. 2 A, 4. 3 A から引き出されており、その中の 1 対の読出しデータ線対 G I O R, / G I O R が X O R ゲート 6 の入力端子に接続される。

【 0 0 1 4 】

図 2 は、この発明の実施の形態 1 による半導体記憶装置 1 A の全体構成を示した概略ブロック図の変形例である。図 2 に示した実施の形態 1 の半導体記憶装置 1 A - 2 は、X O R ゲート 6 が N A N D ゲート 7 に置き換えられた点で、図 1 の半導体記憶装置 1 A と異なる。

【 0 0 1 5 】

X O R ゲートと N A N D ゲートとは、入力 (0 , 0) の時の出力が異なるのみである。一方、読出しデータ線対 G I O R, / G I O R が H レベルでプリチャージされる場合には、通常動作時に読出しデータ線対 G I O R, / G I O R が共に L レベルとなることはない。したがって、セルフプリチャージ信号 S E L F P R E を生成するのに、X O R ゲート 6 の代わりに N A N D ゲート 7 を使用することができる。

【 0 0 1 6 】

N A N D ゲートは、一般に X O R ゲートより少ないトランジスタで構成できるため、X O R ゲート 6 を N A N D ゲート 7 に置き換えることによって、より少ない占有面積でセルフプリチャージ信号 S E L F P R E を生成することが可能となる。なお、この X O R ゲート 6 から N A N D ゲート 7 への置き換えは、他の実施の形態の X O R ゲート 6 に対しても同様に行なうことができる。

【 0 0 1 7 】

次に、センスアンプ帯 4. 1 A, 4. 2 A, 4. 3 A を代表したセンスアンプ帯 4. 2 A のうち、X O R ゲート 6 の入力端子に接続された読出しデータ線対 G I O R, / G I O R 周辺の具体的回路構成について説明する。

【 0 0 1 8 】

図 3 は、この発明の実施の形態 1 によるセンスアンプ帯 4. 2 A の一部回路構成を示した回路図である。

【 0 0 1 9 】

図 3 に示すように、実施の形態 1 のセンスアンプ帯 4. 2 A は、メモリセル 2 0 を含むメモリブロック 5. 2 と隣接し、センスアンプ 1 0 と、P チャネル MOS トランジスタ 1 5 と、N チャネル MOS トランジスタ 1 6 と、分離ゲート回路 1 7 と、読出しゲート回路 3 0 と、プリアンプ 4 0 と、メインアンプ 4 1 とを含む。

【 0 0 2 0 】

センスアンプ 1 0 は、ビット線対 B L, / B L の間に接続され、センスアンプ駆動線 S P L 側に接続された P チャネル MOS トランジスタ 1 1, 1 2 と、センスアンプ駆動線 S N L 側に接続された N チャネル MOS トランジスタ 1 3, 1 4 とを含む。

【 0 0 2 1 】

センスアンプ駆動線 S P L は、P チャネル MOS トランジスタ 1 5 に入力されるセンスアンプ活性化信号 / S O P によって電源電位 V C C に駆動される。センスアンプ駆動線 S N L は、N チャネル MOS トランジスタ 1 6 に入力されるセンスアンプ活性化信号 S O N によって接地電位 G N D に駆動される。

【 0 0 2 2 】

メモリブロック 5. 2 内のメモリセル 2 0 は、ゲートがワード線 W L に、ドレインがビット線 / B L にそれぞれ接続された N チャネル MOS トランジスタ 2 1 と、一方の端子が N チャネル MOS トランジスタ 2 1 のソースに接続され、他方の端子が所定の電位に固定されたキャパシタ 2 2 とを含む。このメモリセル 2 0 は、メモリブロック 5. 2 に含まれる複数のメモリセルの 1 つを代表して示したものである。

【 0 0 2 3 】

分離ゲート回路 1 7 は、N チャネル MOS トランジスタ 1 8, 1 9 を含み、ビット線分離信号 B L I に応じて、ビット線対 B L, / B L のセンスアンプ帯 4. 2 A 側とメモリブロック 5. 2 側とを電氣的に接続 / 分離する。

【 0 0 2 4 】

読出しゲート回路 3 0 は、ビット線対 B L, / B L の間に接続される。読出しゲート回路 3 0 は、ゲートがビット線対 B L, / B L にそれぞれ接続され、ソー

スがともに接地ノードに接続されたNチャネルMOSトランジスタ31、32と、ソースがNチャネルMOSトランジスタ31、32のドレインにそれぞれ接続され、ドレインが読出しデータ線対GIOR、／GIORにそれぞれ接続されたNチャネルMOSトランジスタ33、34とを含む。NチャネルMOSトランジスタ33、34は、コラム選択線CSLRの活性化／非活性化に応じてオン／オフする。

【0025】

プリアンプ40は、読出しデータ線対GIOR、／GIORに接続される。プリアンプ40は、読出しデータ線対に読み出されたデータが入力され、プリアンプ活性化信号PAEに応じて、データをシングルエンド出力する。

【0026】

メインアンプ41は、プリアンプ40からシングルエンド出力されたデータをバッファリングして、データ出力ピンQにデータを出力する。

【0027】

読出しデータ線対GIOR、／GIORから出力されたデータは、図1のXORゲート6または図2のNANDゲート7に入力され、XORゲート6またはNANDゲート7は、読出しデータ線対GIOR、／GIORの電位差が開いたときにセルフプリチャージ信号SELFPREを出力する。

【0028】

図4は、この発明の実施の形態1による中央制御回路2A-1の回路構成を示した回路図である。

【0029】

図4を参照して、実施の形態1の中央制御回路2A-1は、制御信号extACTをクロック信号extCLKの立上がりに応じて取込み信号ACTを出力するDフリップフロップ回路51と、制御信号extPREをクロック信号extCLKの立上がりに応じて取込むDフリップフロップ回路52と、Dフリップフロップ回路52の出力と図1のXORゲート6または図2のNANDゲート7から発生したセルフプリチャージ信号SELFPREとを受けてプリチャージ信号PREを出力するORゲート53と、信号ACT、PREを受けるラッチ回路5

4 と、ラッチ回路 5 4 の出力を受けて反転し信号 `intRAS` を出力するインバータ 5 7 とを含む。

【0030】

ORゲート 5 3 は、Dフリップフロップ回路 5 2 の出力が立上がった場合だけでなく、セルフプリチャージ信号 `SELFPRE` が立上がった場合にもプリチャージ信号 `PRE` を出力する。このため、制御信号 `extPRE` による外部からのプリチャージコマンドがなくともセルフプリチャージ動作が可能となる。

【0031】

また、ラッチ回路 5 4 は、信号 `ACT` を一方の入力に受けるORゲート 5 5 と、信号 `PRE` の反転信号およびORゲート 5 5 の出力を受けるNANDゲート 5 6 とを含む。NANDゲート 5 6 の出力は、ORゲート 5 5 の他方の入力に反転して与えられるのと同時に、インバータ 5 7 の入力にも与えられる。

【0032】

中央制御回路 2 A - 1 は、さらに、信号 `intRAS` と信号 `SRAS` とを受けるNORゲート 5 8 と、NORゲート 5 8 の出力を受けて遅延させる遅延回路 5 9 と、遅延回路 5 9 の出力およびNORゲート 5 8 の出力を受けるNANDゲート 6 0 と、NANDゲート 6 0 の出力を遅延させる遅延回路 6 1 と、遅延回路 6 1 の出力およびNANDゲート 6 0 の出力を受けるNANDゲート 6 2 と、NANDゲート 6 2 の出力を受けて反転し信号 `RXT` を出力するインバータ 6 3 とを含む。信号 `RXT` はワード線の活性化タイミングを示すトリガ信号である。

【0033】

中央制御回路 2 A - 1 は、さらに、NANDゲート 6 2 の出力を受けて遅延させる遅延回路 6 4 と、遅延回路 6 4 の出力およびNANDゲート 6 2 の出力を受けるNANDゲート 6 5 と、NANDゲート 6 5 の出力を受けて遅延させる遅延回路 6 6 と、遅延回路 6 6 の出力およびNANDゲート 6 5 の出力を受けるNANDゲート 6 7 と、NANDゲート 6 7 の出力を受けて反転し信号 `RAL` を出力するインバータ 6 8 とを含む。信号 `RAL` は、ロウアドレスをラッチするタイミングを示す信号である。

【0034】

中央制御回路 2A-1 は、さらに、セクタ 71, 75 を含む。

セクタ 71 は、外部から与えられるロウアドレス信号 $\text{extRA} \langle 12:8 \rangle$, $\text{extRA} \langle 1:0 \rangle$ と、リフレッシュ時のアドレス $\text{QA} \langle 12:0 \rangle$ の対応するビットとを受けて、セルフリフレッシュ信号 SELFREF が H レベルの場合にはリフレッシュアドレスを出力し、セルフリフレッシュ信号 SELFREF が L レベルの場合には外部ロウアドレス信号を出力する。

【0035】

セクタ 75 は、外部から与えられるロウアドレス信号 $\text{extRA} \langle 7:2 \rangle$ とリフレッシュ用のアドレス $\text{QA} \langle 12:0 \rangle$ の対応するビットとを受けて、セルフリフレッシュ信号 SELFREF が H レベルの場合にはセルフリフレッシュ用のアドレスを出力し、セルフリフレッシュ信号 SELFREF が L レベルの場合には外部ロウアドレス信号を出力する。

【0036】

中央制御回路 2A-1 は、さらに、セクタ 71 の出力をデコードするデコード回路 72 と、クロック信号 extCLK , PHY を受ける OR ゲート 73 と、OR ゲート 73 の出力の立上がりに応じてデコード回路 72 の出力を取込み、デコードされたアドレス信号 $\text{XO} \langle 1:0 \rangle$, $\text{XN} \langle 3:0 \rangle$, $\text{XM} \langle 3:0 \rangle$, $\text{XSD} \langle 3:0 \rangle$ を出力する D フリップフロップ回路 74 と、信号 extCLK , PHY を受ける OR ゲート 76 と、OR ゲート 76 の出力の立上がりに応じてセクタ 75 の出力を取込みロウアドレス信号 $\text{RA} \langle 7:2 \rangle$ を出力する D フリップフロップ回路 77 とを含む。

【0037】

中央制御回路 2A-1 は、さらに、制御信号 extSREF をクロック信号 extCLK の立上がりに応じて取込みセルフリフレッシュ信号 SELFREF を出力する D フリップフロップ回路 78 と、セルフリフレッシュ信号 SELFREF の活性化に応じてセルフリフレッシュ時のロウアドレスストロブ信号である信号 SRAS を出力し、リフレッシュ時のアドレス信号 $\text{QA} \langle 12:0 \rangle$ を発生し、クロック信号 PHY を出力するセルフリフレッシュ信号発生回路 79 とを含む。

【 0 0 3 8 】

中央制御回路 2 A - 1 は、さらに、制御信号 $ext\ READ$ をクロック信号 $ext\ CLK$ の立上がりに応じて取込み信号 $READ$ を出力する D フリップフロップ回路 8 1 と、信号 $READ$ を受けて遅延させる遅延回路 8 2 と、遅延回路 8 2 の出力および信号 $READ$ を受ける NAND ゲート 8 3 と、NAND ゲート 8 3 の出力を受けて遅延させる遅延回路 8 4 と、遅延回路 8 4 の出力および NAND ゲート 8 3 の出力を受ける NAND ゲート 8 5 と、NAND ゲート 8 5 の出力を受けて反転しプリアンプ活性化信号 PAE を出力するインバータ 8 6 とを含む。

【 0 0 3 9 】

図 5 は、中央制御回路 2 A - 1 によって制御されるセンスアンプ帯 4 . 2 A の回路動作を説明するための動作波形図である。

【 0 0 4 0 】

まず、時刻 t_1 において、ACT コマンド (アクティベートコマンド) が発行され、ロウアドレスが入力される。

【 0 0 4 1 】

ロウアドレスの入力を受けて、時刻 t_2 において、ワード線 WL が活性化される。ワード線 WL が活性化されることによって、メモリセル 2 0 中の N チャネル MOS トランジスタ 2 1 がオンし、キャパシタ 2 2 からビット線 / BL に電荷が流れ込む。その結果、共に予め $VCC_a / 2$ にイコライズされていたビット線対 BL , / BL に微小な電位差が生じる。なお、 VCC_a は、半導体記憶装置のメモリセルアレイにおける振幅電圧を表わす。

【 0 0 4 2 】

また、ロウアドレスが入力されることにより、共に予め $VCC_a / 2$ にイコライズされていたセンスアンプ駆動線 SPL , SNL が、電源電位 VCC , 接地電位 GND にそれぞれ駆動される。これにより、ビット線対 BL , / BL の微小電位差が、電源電位 VCC と接地電位 GND との電位差にまで増幅される。

【 0 0 4 3 】

時刻 t_3 において、RD コマンド (リードコマンド) が発行され、コラムアドレスが入力される。

【0044】

コラムアドレスの入力を受けて、時刻 t_4 において、リードコラム選択線 CSLR が活性化される。リードコラム選択線 CSLR が活性化されることによって、共に予め H レベル（論理ハイ）にプリチャージされていた読出しデータ線対 GIOR, \neg GIOR は、ビット線対 BL, \neg BL に読出されたデータに基づいて、H レベル、L レベルにそれぞれ駆動される。

【0045】

このように読出しデータ線対 GIOR, \neg GIOR の電位差が開くことによって、図 1 の XOR ゲート 6 または図 2 の NAND ゲート 7 を通じてセルフプリチャージ信号 SELFPRE が発生する。セルフプリチャージ信号 SELFPRE の発生を受けて、ワード線 WL が非活性化されるとともに、時刻 t_5 において、センスアンプ駆動線 SPL, SNL が共に $VCC_a/2$ にイコライズされる。これにより、ビット線対 BL, \neg BL が共に $VCC_a/2$ にイコライズされる。

【0046】

また、コラムアドレスが入力されることにより、プリアンプ活性化信号 PAE が活性化される。このプリアンプ活性化信号 PAE の活性化を受けて、読出しデータ線対 GIOR, \neg GIOR に出力されたデータは、プリアンプ 40, メインアンプ 41 を介して、データ出力ピン Q に出力される。

【0047】

したがって、RD コマンド発行時に読出しデータ線対 GIOR, \neg GIOR の電位差が開き次第、自己整合的にプリチャージ動作が実行される。ゆえに、実施の形態 1 による半導体記憶装置は、RD コマンド発行時に外部からのプリチャージコマンドが不要となり、かつ高速化が容易となる。

【0048】

また、プリチャージ動作のタイミングは、プロセスばらつき、電圧上下限、高温/低温といった一般に動作速度が変化する条件に追従するので、外部コマンドでタイミングが固定されたプリチャージコマンドを発行した場合と比べて、タイミング設計が容易となる。

【0049】

なお、上記では読出し動作時のみセルフプリチャージ動作を行ない、書込み動作時には外部からプリチャージコマンドを与えることを想定している。しかしながら、書込み動作時であっても読出し動作を常に同時に行なえば、書込み動作時にもプリチャージ動作を行なうことが可能となり、図 4 の中央制御回路 2 A - 1 において、D フリップフロップ回路 5 2 および O R ゲート 5 3 を取り除き、セルフプリチャージ信号 S E L F P R E を直接ラッチ回路 5 4 に入力することも可能となる。この場合の実施の形態については、次の実施の形態 2 において詳しく説明する。

【 0 0 5 0 】

図 6 は、この発明の実施の形態 1 による中央制御回路 2 A - 2 の回路構成を示した回路図である。

【 0 0 5 1 】

図 6 に示した実施の形態 1 の中央制御回路 2 A - 2 は、セルフプリチャージ信号 S E L F P R E が O R ゲート 5 3 に入力される前段に遅延素子 6 9 が挿入された点で、図 4 の中央制御回路 2 A と異なる。このように、セルフプリチャージ信号 S E L F P R E を遅延素子 6 9 で遅延させてから O R ゲート 5 3 に入力することによって、この発明による半導体記憶装置の動作マージンをさらに向上させることができ、タイミング調整も容易となる。

【 0 0 5 2 】

図 7 は、この発明の実施の形態 1 による中央制御回路 2 A - 3 の回路構成を示した回路図である。

【 0 0 5 3 】

図 7 に示した実施の形態 1 の中央制御回路 2 A - 3 は、信号 R E A D およびその遅延信号の代わりにセルフプリチャージ信号 S E L F P R E およびその遅延信号を N A N D ゲート 8 3 に入力し、最終的にプリアンプ活性化信号を生成する点で、図 4 の中央制御回路 2 A - 1 と異なる。

【 0 0 5 4 】

図 8 は、中央制御回路 2 A - 3 によって制御されるセンスアンプ帯 4 . 2 A の回路動作を説明するための動作波形図である。

【 0 0 5 5 】

図 8 に示した動作波形図は、コラムアドレスの入力によってではなく、セルフプリチャージ信号 S E L F P R E の発生を受けて、プリアンプ活性化信号 P A E が活性化される点で、図 5 の動作波形図と異なる。

【 0 0 5 6 】

このように、セルフプリチャージ信号 S E L F P R E の発生を受けてプリアンプ活性化信号 P A E が活性化されることで、コラムアドレスの入力を受けた場合と比べてプリアンプ活性化信号 P A E が活性化されるまでの遅延量が少なくて済む。また、プリアンプ活性化信号 P A E の活性化が読出しデータ線対 G I O R, / G I O R の電位差の開きに追従するため、タイミング設計が容易となる。

【 0 0 5 7 】

以上のように、実施の形態 1 によれば、R D コマンド発行時に読出しデータ線対 G I O R, / G I O R の電位差が開き次第、自己整合的にプリチャージ動作が実行されることによって、R D コマンド発行時に外部からのプリチャージコマンドが不要となり、かつ高速化が容易となる。

【 0 0 5 8 】

〔実施の形態 2〕

図 9 は、この発明の実施の形態 2 による半導体記憶装置 1 B の全体構成を示した概略ブロック図である。

【 0 0 5 9 】

図 9 に示した実施の形態 2 の半導体記憶装置 1 B は、中央制御回路 2 A, センスアンプ帯 4. 1 A, 4. 2 A, 4. 3 A が、中央制御回路 2 B, センスアンプ帯 4. 1 B, 4. 2 B, 4. 3 B にそれぞれ置き換えられた構成となっている。中央制御回路 2 B、およびセンスアンプ帯 4. 1 B, 4. 2 B, 4. 3 B を代表したセンスアンプ帯 4. 2 B の具体的構成については後に詳述する。なお、実施の形態 1 の図 2 に関連して説明したように、図 9 の X O R ゲート 6 は、N A N D ゲート 7 と置換可能である。

【 0 0 6 0 】

図 1 0 は、この発明の実施の形態 2 によるセンスアンプ帯 4. 2 B の一部回路

構成を示した回路図である。

【 0 0 6 1 】

図 1 0 に示した実施の形態 2 のセンスアンプ帯 4 . 2 B は、図 2 に示した実施の形態 1 のセンスアンプ帯 4 . 2 A における読出しゲート回路 3 0 が読出しゲート回路 3 0 a に置き換えられた構成となっている。読出しゲート回路 3 0 a は、NチャネルMOSトランジスタ 3 1 , 3 2 のソースが、接地ノードではなくセンスアンプ駆動線 S N L に接続されている点で、読出しゲート回路 3 0 と異なる。

【 0 0 6 2 】

実施の形態 2 のセンスアンプ帯 4 . 2 B では、NチャネルMOSトランジスタ 3 1 , 3 2 のソースがセンスアンプ駆動線 S N L に接続されているので、センスアンプ 1 3 が活性化するまではNチャネルMOSトランジスタ 2 7 , 2 8 は共にオフの状態となる。

【 0 0 6 3 】

よって、センスアンプ 1 0 が活性化される前にリードコラム選択線 C S L R を選択しても、NチャネルMOSトランジスタ 3 1 , 3 2 が共にオフの状態のため、プリチャージされた読出しデータ線対 G I O R , / G I O R の電荷が共にグラウンドに向けて引き抜かれることはなく、プリアンプの入力が共に L レベルとはならないので、正常なデータ読出しが可能である。

【 0 0 6 4 】

したがって、NチャネルMOSトランジスタ 3 1 , 3 2 のソースがセンスアンプ駆動線 S N L に接続されることによって、センスアンプ 1 0 が活性化される前にリードコラム選択線 C S L R を選択しておくことが可能となる。これにより、従来の半導体記憶装置において必要だった、A C T コマンド発行から R D コマンド発行までの待ち時間をなくすることが可能となった。

【 0 0 6 5 】

ゆえに、実施の形態 2 の半導体記憶装置は、従来の半導体記憶装置のようにセンスアンプが活性化されてビット線間の電圧が十分増幅されるのを待ってからコラム選択線を活性化するのに比べて、データを高速に読み出すことができる。同じことは、データを高速に書き込む際にも言える。

【 0 0 6 6 】

なお、センスアンプでの増幅が十分行なわれてからコラム選択線の活性化を行なうようにするためのタイミング調整には、一般に遅延素子が用いられる。しかしながら、遅延素子の遅延値は、プロセスばらつきや電源電圧および周囲温度の変動などにより大きくばらつく場合がある。従来の半導体記憶装置では、このばらつきをマージンに含めてタイミング調整を行なわねばならず、データ出力が遅くなる要因の一つとなっていた。

【 0 0 6 7 】

これに対して、実施の形態 2 の半導体記憶装置では、コラム選択線の動作タイミングを細かく調整する必要がないので、プロセスばらつきや電源電圧および周囲温度の変動などによる影響を受けにくい。そのため、プロセスばらつきがワーストに振れた場合や電圧下限および高温状態など一般に半導体記憶装置の動作が遅れる条件下でも、従来の半導体記憶装置に比べて動作の遅れを小さくできる。

【 0 0 6 8 】

図 1 1 は、この発明の実施の形態 2 による中央制御回路 2 B - 1 の回路構成を示した回路図である。ここでは、図 4 に示した実施の形態 1 の中央制御回路 2 A - 1 と異なる部分について説明する。

【 0 0 6 9 】

図 1 1 を参照して、中央制御回路 2 B - 1 は、制御信号 `extWRITE` をクロック信号 `extCLK` の立上がりに応じて取込む D フリップフロップ回路 1 0 1 と、D フリップフロップ回路 1 0 1 の出力信号 `WRITE` および D フリップフロップ回路 8 1 の出力信号 `READ` を受けて信号 `ACT` を出力する OR ゲート 1 0 2 と、信号 `ACT` およびセルフプリチャージ信号 `SELFPRE` を受けるラッチ回路 5 4 a と、ラッチ回路 5 4 a の出力を受けて反転し信号 `intRAS` を出力するインバータ 5 7 a とを含む。

【 0 0 7 0 】

OR ゲート 1 0 2 は、信号 `WRITE` または `READ` の立上がりを受けて信号 `ACT` を出力する。また、ラッチ回路 5 4 a は、こうして生成された信号 `ACT` を一方の入力に受け、もう一方の入力にはセルフプリチャージ信号 `SELFPR`

Eが直接入力される。

【0071】

また、ラッチ回路54aは、信号ACTを一方の入力に受けるORゲート55aと、セルフプリチャージ信号SELFPREの反転信号およびORゲート55aの出力を受けるNANDゲート56aとを含む。NANDゲート56aの出力は、ORゲート55aの他方の入力に反転して与えられるのと同時に、インバータ57aの入力にも与えられる。

【0072】

このように、Dフリップフロップ回路52およびORゲート53を取り除き、セルフプリチャージ信号SELFPREを直接ラッチ回路54に入力することによって、タイミング設計がさらに容易となる。

【0073】

図12は、中央制御回路2B-1によって制御されるセンスアンプ帯4、2Bの回路動作を説明するための動作波形図である。

【0074】

まず、時刻t1において、RDコマンド（リードコマンド）が発行され、ロウアドレスおよびコラムアドレスが同時に入力される。なお、実施の形態2では、書込み動作時であっても、常に読出し動作を同時に行なうこととする。

【0075】

ロウアドレスの入力を受けて、ワード線WLが活性化される。ワード線WLが活性化されることによって、メモリセル20中のNチャネルMOSトランジスタ21がオンし、キャパシタ22からビット線／BLに電荷が流れ込む。その結果、共に予めVCCa/2にイコライズされていたビット線対BL，／BLに微小な電位差が生じる。

【0076】

一方、ロウアドレスと同時に入力されたコラムアドレスの入力を受けて、センスアンプ10が活性化される前にリードコラム選択線CSLRが活性化される。

【0077】

リードコラム選択線CSLRが活性化された後、ロウアドレスの入力を受けて

、共に予め $VCCa/2$ にイコライズされていたセンスアンプ駆動線 SPL 、 SNL が電源電位 VCC 、接地電位 GND にそれぞれ駆動される。これにより、ビット線対 BL 、 $/BL$ の微小電位差が、電源電位 VCC と接地電位 GND との電位差にまで増幅される。

【0078】

ビット線対 BL 、 $/BL$ の微小電位差が、電源電位 VCC と接地電位 GND との電位差にまで増幅されることにより、共に予め H レベル（論理ハイ）にプリチャージされていた相補の読出しデータ線対 $G I O R$ 、 $/G I O R$ は、ビット線対 BL 、 $/BL$ に読出されたデータに基づいて、 H レベル、 L レベルにそれぞれ駆動される。

【0079】

このように読出しデータ線対 $G I O R$ 、 $/G I O R$ の電位差が開くことによって、図9の XOR ゲート6（または、 $NAND$ ゲート7）を通じてセルフプリチャージ信号 $SELFPRE$ が発生する。セルフプリチャージ信号 $SELFPRE$ の発生を受けて、ワード線 WL が非活性化されるとともに、センスアンプ駆動線 SPL 、 SNL が共に $VCCa/2$ にイコライズされる。これにより、ビット線対 BL 、 $/BL$ が共に $VCCa/2$ にイコライズされる。

【0080】

また、コラムアドレスが入力されることにより、プリアンプ活性化信号 PAE が活性化される。このプリアンプ活性化信号 PAE の活性化を受けて、読出しデータ線対 $G I O R$ 、 $/G I O R$ に出力されたデータは、プリアンプ40、メインアンプ41を介して、データ出力ピン Q に出力される。

【0081】

したがって、 RD コマンド発行時に読出しデータ線対 $G I O R$ 、 $/G I O R$ の電位差が開き次第、自己整合的にプリチャージ動作が実行される。ゆえに、実施の形態2の半導体記憶装置は、 RD コマンド発行時に外部からのプリチャージコマンドが不要となり、かつ高速化が容易となる。

【0082】

また、プリチャージ動作のタイミングは、プロセスばらつき、電圧上下限、高

温／低温といった一般に動作速度が変化する条件に追随し、かつセルフプリチャージ信号SELFPREがラッチ回路54aに直接入力されるので、外部コマンドでタイミングが固定されたプリチャージコマンドを発行した場合と比べて、タイミング設計がさらに容易となる。

【0083】

図13は、この発明の実施の形態2による中央制御回路2B-2の回路構成を示した回路図である。

【0084】

図13に示した実施の形態2の中央制御回路2B-2は、セルフプリチャージ信号SELFPREがORゲート102に入力される前段に遅延素子69が挿入された点で、図10の中央制御回路2B-1と異なる。このように、セルフプリチャージ信号SELFPREを遅延素子69で遅延させてからORゲート102に入力することによって、この発明による半導体記憶装置の動作マージンをさらに向上させることができ、タイミング調整も容易となる。

【0085】

図14は、この発明の実施の形態2による中央制御回路2B-3の回路構成を示した回路図である。

【0086】

図14に示した実施の形態2の中央制御回路2B-3は、信号READおよびその遅延信号の代わりにセルフプリチャージ信号SELFPREおよびその遅延信号をNANDゲート83に入力し、最終的にプリアンプ活性化信号を生成する点で、図10の中央制御回路2Bと異なる。

【0087】

図15は、中央制御回路2B-3によって制御されるセンスアンプ帯4、2Bの回路動作を説明するための動作波形図である。

【0088】

図15に示した動作波形図は、コラムアドレスの入力によってではなく、セルフプリチャージ信号SELFPREの発生を受けて、プリアンプ活性化信号PAEが活性化される点で、図12の動作波形図と異なる。

【0089】

このように、セルフプリチャージ信号SELFPREの発生を受けてプリアンブ活性化信号PAEが活性化されることで、コラムアドレスの入力を受けた場合と比べてプリアンブ活性化信号PAEが活性化されるまでの遅延量が少なく済む。また、プリアンブ活性化信号PAEの活性化が読出しデータ線対GIOR、 \neg GIORの電位差の開きに追従するため、タイミング設計が容易となる。

【0090】

以上のように、実施の形態2では、実施の形態1での効果に加えて、NチャネルMOSトランジスタ31、32のソースがセンスアンプ駆動線SNLに接続されることによって、高速なランダムアクセスを実現しつつ、常に正常なデータ読出しが可能となる。

【0091】

また、セルフプリチャージ信号SELFPREがラッチ回路54aに直接入力されることによって、タイミング設計がさらに容易となる。

【0092】

〔実施の形態3〕

図16は、この発明の実施の形態3による半導体記憶装置1Cの全体構成を示した概略ブロック図である。

【0093】

図16に示した実施の形態3の半導体記憶装置1Cは、実施の形態2の半導体記憶装置1Bの構成において、複数の読出しデータ線対GIOR<m>、 \neg GIOR<m> (m=1~n: nは自然数) が実際に図示され、その中からXORゲート6の入力端子に到達するまでの距離が最短となる読出しデータ線対GIOR<0>、 \neg GIOR<0>がXORゲート6に接続された構成となっている。なお、この実施の形態3による半導体記憶装置1Cの構成は、実施の形態1の半導体記憶装置1Aに対しても適応することが可能である。

【0094】

このように、読出しデータ線対がXORゲート6の入力端子に到達するまでの距離が短くなることによって、セルフプリチャージのタイミングを早めることが

可能となる。

【0095】

なお、読出しデータ線対がXORゲート6の入力端子に到達するまでの距離は必ずしも最短でなくてもよく、XORゲート6の入力端子に到達するまでの距離が最長となる読出しデータ線対G I O R < n > , / G I O R < n > 以外の読出しデータ線対であれば、同様の効果が得られる。また、実施の形態1の図2に関連して説明したように、XORゲート6はNANDゲート7と置換可能である。

【0096】

以上のように、実施の形態3によれば、読出しデータ線対がXORゲート6の入力端子に到達するまでの距離を短くすることによって、半導体記憶装置の動作がさらに高速化される。

【0097】

〔実施の形態4〕

図17は、この発明の実施の形態4による半導体記憶装置1Dの全体構成を示した概略ブロック図である。

【0098】

図17に示した実施の形態4の半導体記憶装置1Dは、実施の形態2の半導体記憶装置1Bの構成において、複数の読出しデータ線対G I O R < m > , / G I O R < m > (m = 1 ~ n : n は自然数) が実際に図示され、I O 選択回路8が付加された構成となっている。なお、この実施の形態4による半導体記憶装置1Dの構成は、実施の形態1の半導体記憶装置1Aに対しても適応することが可能である。

【0099】

I O 選択回路8は、複数の読出しデータ線対G I O R < m > , / G I O R < m > の入力を受け、これらの中からある任意の読出しデータ線対を選択し、その読出しデータ線対のデータをXORゲート6に出力する。I O 選択回路8の選択手段としては、たとえばマスク切替え手段、あるいはヒューズプログラミングその他の既知のプログラミング手段などが利用できる。

【0100】

このように、複数の読出しデータ線対の中から任意の読出しデータ線対を選択できることによって、セルフプリチャージのタイミングをより柔軟に設定することができ、その結果、半導体記憶装置の動作の歩留まりが改善される。なお、実施の形態 1 の図 2 に関連して説明したように、XOR ゲート 6 は NAND ゲート 7 と置換可能である。

【0101】

以上のように、実施の形態 4 によれば、複数の読出しデータ線対の中から任意の読出しデータ線対を選択できるようにすることによって、実施の形態 3 での効果に加えて、半導体記憶装置の動作の歩留まりが改善される。

【0102】

なお、これまで述べてきた実施の形態において、セルフプリチャージ用を使用する読出し入出力線のみに入力時にも読出しデータを読み出せるようにし、セルフプリチャージ用に使用しない読出し入出力線には読出し時のみ読出しデータを読み出せるようにすることも可能である。こうすることにより、書き込み時の動作電流を減少させることができる。

【0103】

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【0104】

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、新たな外部信号線および外部制御を必要とせずにメモリ動作の高速化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この発明の実施の形態 1 による半導体記憶装置 1 A の全体構成を示した概略ブロック図である。

【図 2】 この発明の実施の形態 1 による半導体記憶装置 1 A の全体構成を示した概略ブロック図の変形例である。

【図 3】 この発明の実施の形態 1 によるセンスアンプ帯 4. 2 A の一部回路構成を示した回路図である。

【図 4】 この発明の実施の形態 1 による中央制御回路 2 A - 1 の回路構成を示した回路図である。

【図 5】 中央制御回路 2 A - 1 によって制御されるセンスアンプ帯 4. 2 A の回路動作を説明するための動作波形図である。

【図 6】 この発明の実施の形態 1 による中央制御回路 2 A - 2 の回路構成を示した回路図である。

【図 7】 この発明の実施の形態 1 による中央制御回路 2 A - 3 の回路構成を示した回路図である。

【図 8】 中央制御回路 2 A - 3 によって制御されるセンスアンプ帯 4. 2 A の回路動作を説明するための動作波形図である。

【図 9】 この発明の実施の形態 2 による半導体記憶装置 1 B の全体構成を示した概略ブロック図である。

【図 1 0】 この発明の実施の形態 2 によるセンスアンプ帯 4. 2 B の一部回路構成を示した回路図である。

【図 1 1】 この発明の実施の形態 2 による中央制御回路 2 B - 1 の回路構成を示した回路図である。

【図 1 2】 中央制御回路 2 B - 1 によって制御されるセンスアンプ帯 4. 2 B の回路動作を説明するための動作波形図である。

【図 1 3】 この発明の実施の形態 2 による中央制御回路 2 B - 2 の回路構成を示した回路図である。

【図 1 4】 この発明の実施の形態 2 による中央制御回路 2 B - 3 の回路構成を示した回路図である。

【図 1 5】 中央制御回路 2 B - 3 によって制御されるセンスアンプ帯 4. 2 B の回路動作を説明するための動作波形図である。

【図 1 6】 この発明の実施の形態 3 による半導体記憶装置 1 C の全体構成を示した概略ブロック図である。

【図 1 7】 この発明の実施の形態 4 による半導体記憶装置 1 D の全体構成

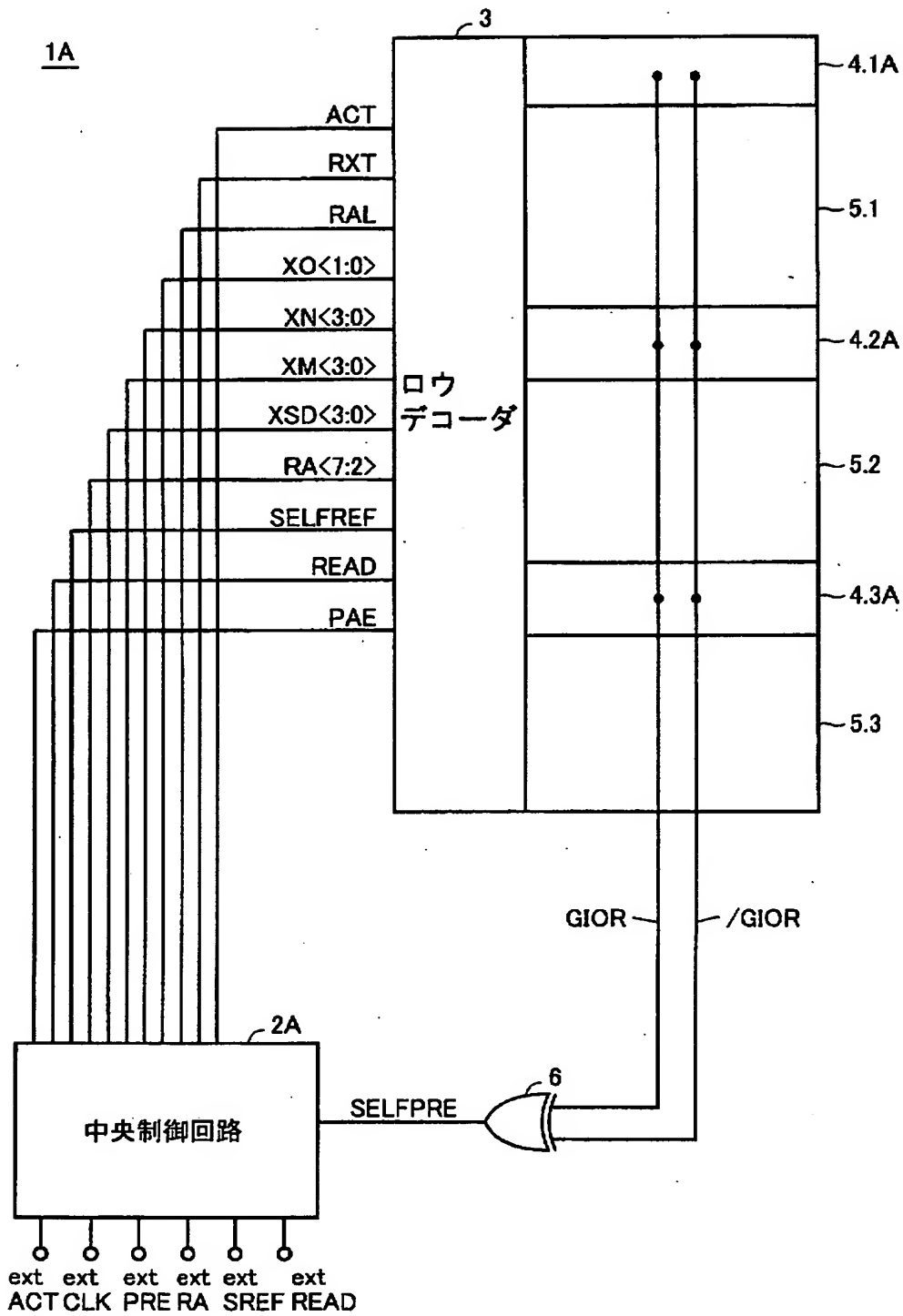
を示した概略ブロック図である。

【符号の説明】

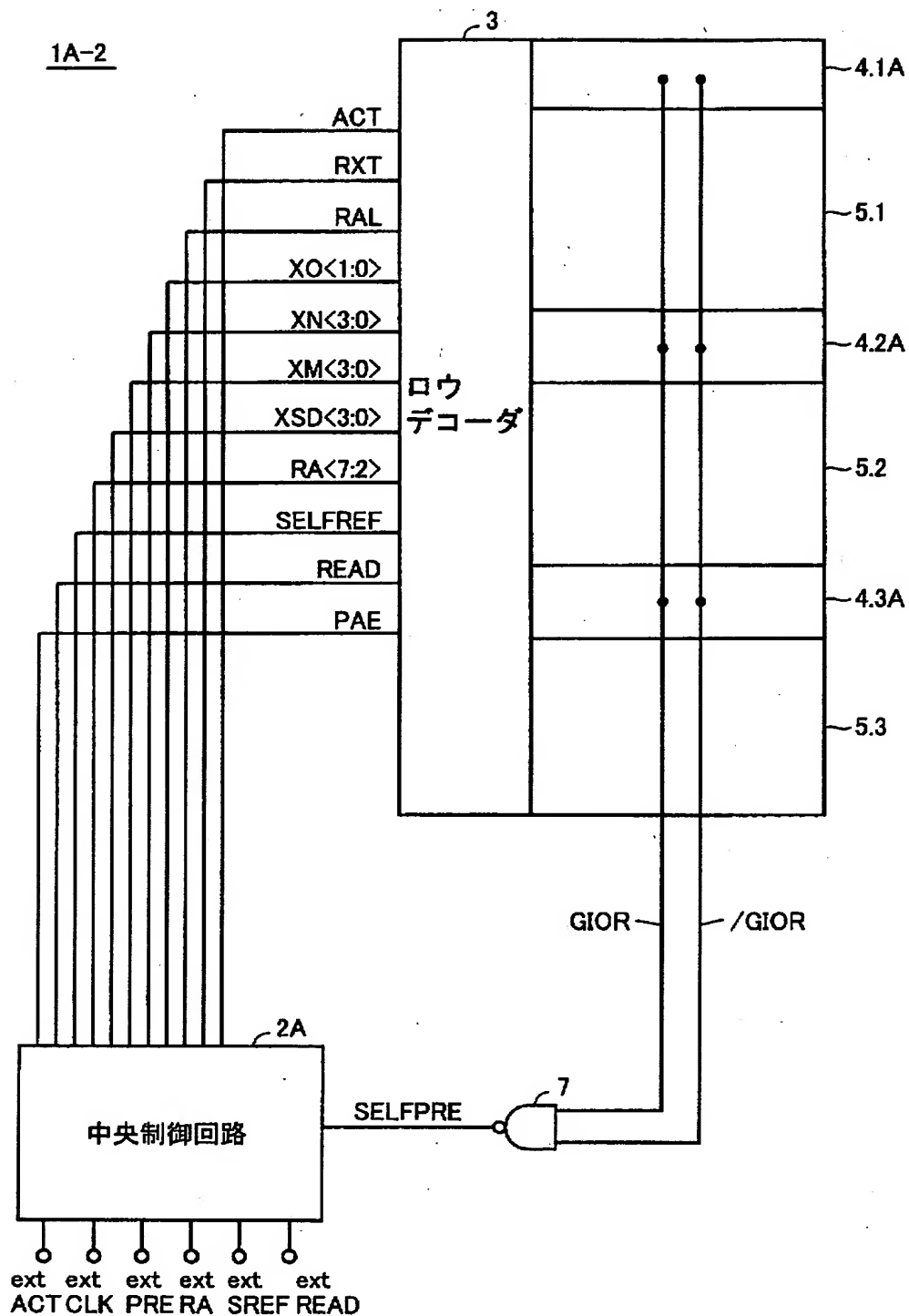
1 A, 1 A-2, 1 B, 1 C, 1 D 半導体記憶装置、2 A, 2 B 中央制御回路、3 ロウデコーダ、4. 1 A, 4. 2 A, 4. 3 A, 4. 1 B, 4. 2 B, 4. 3 B センスアンプ帯、5. 1, 5. 2, 5. 3 メモリブロック、6 XORゲート、7, 60, 62, 65, 67, 83, 85 NANDゲート、8 IO選択回路、10 センスアンプ、15 PチャネルMOSトランジスタ、16, 21 NチャネルMOSトランジスタ、17 分離ゲート回路、20 メモリセル、22 キャパシタ、30, 30a 読出しゲート回路、40 プリアンプ、41 メインアンプ、51, 52, 74, 77, 78, 81, 101 Dフリップフロップ回路、53, 73, 76, 102 ORゲート、54, 54a ラッチ回路、57, 57a, 63, 68, 86 インバータ、58 NORゲート、59, 61, 64, 66, 69, 82, 84 遅延回路、71, 75 セレクタ、72 デコード回路、79 セルフリフレッシュ信号発生回路。

【書類名】 図面

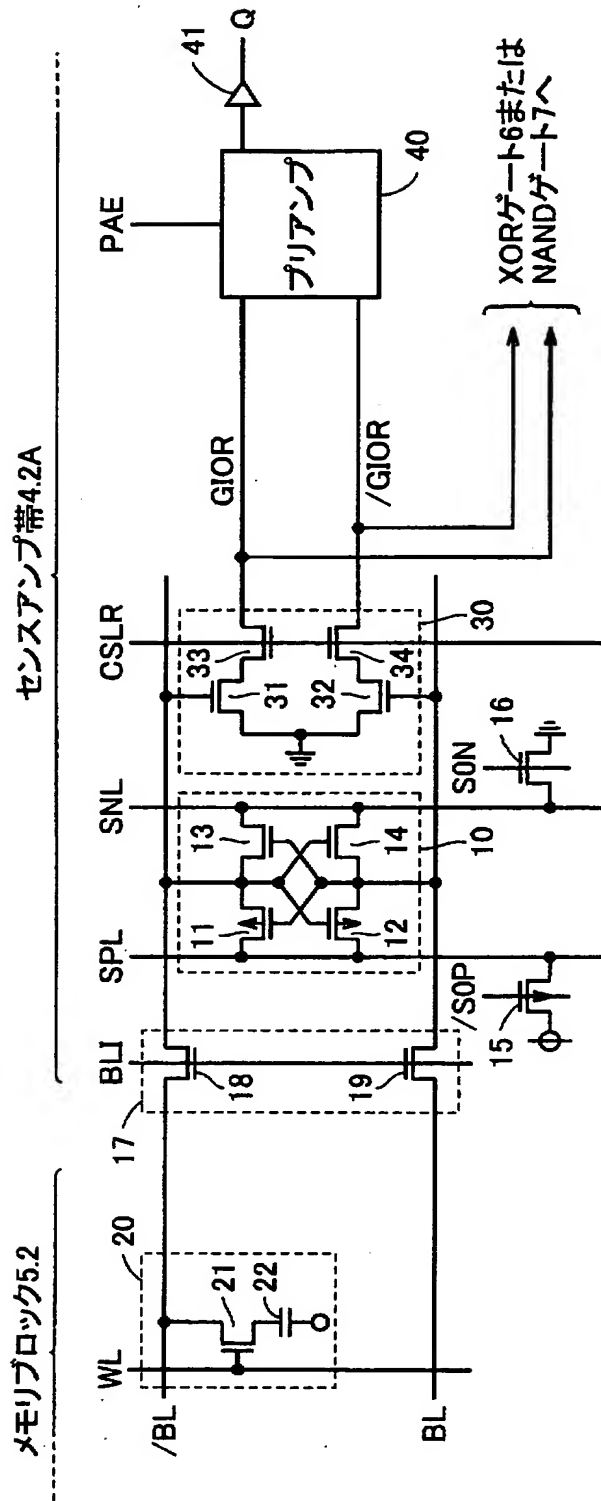
【図 1】



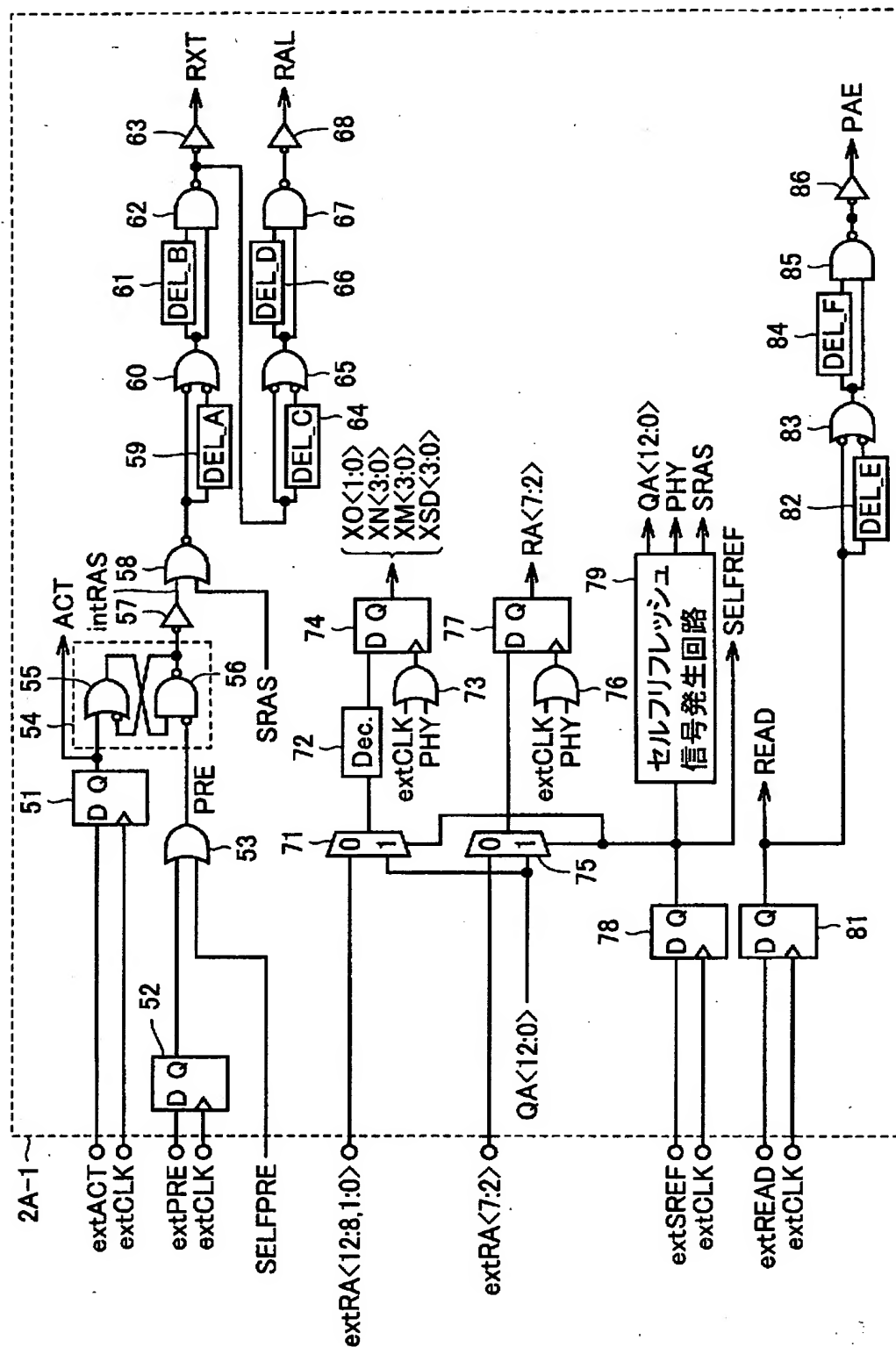
【図 2】



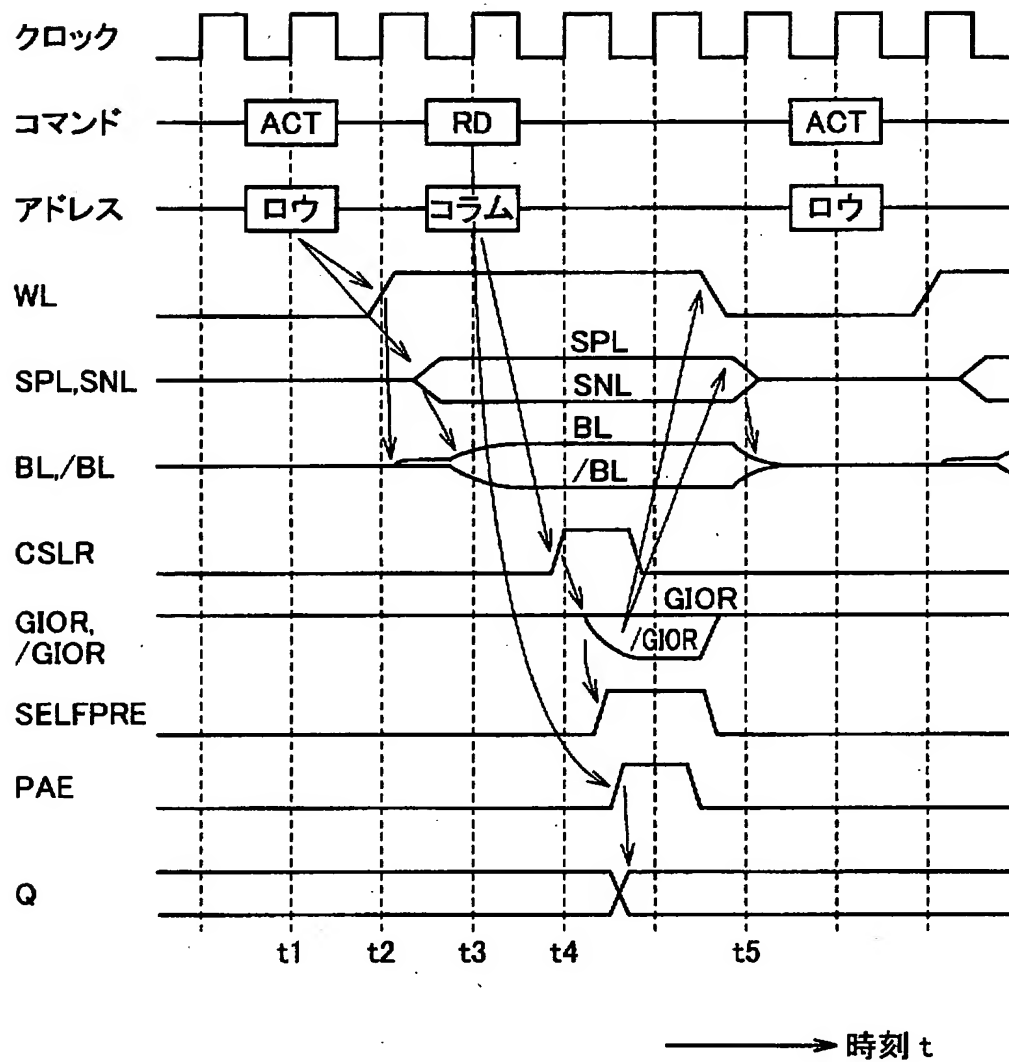
【図 3】



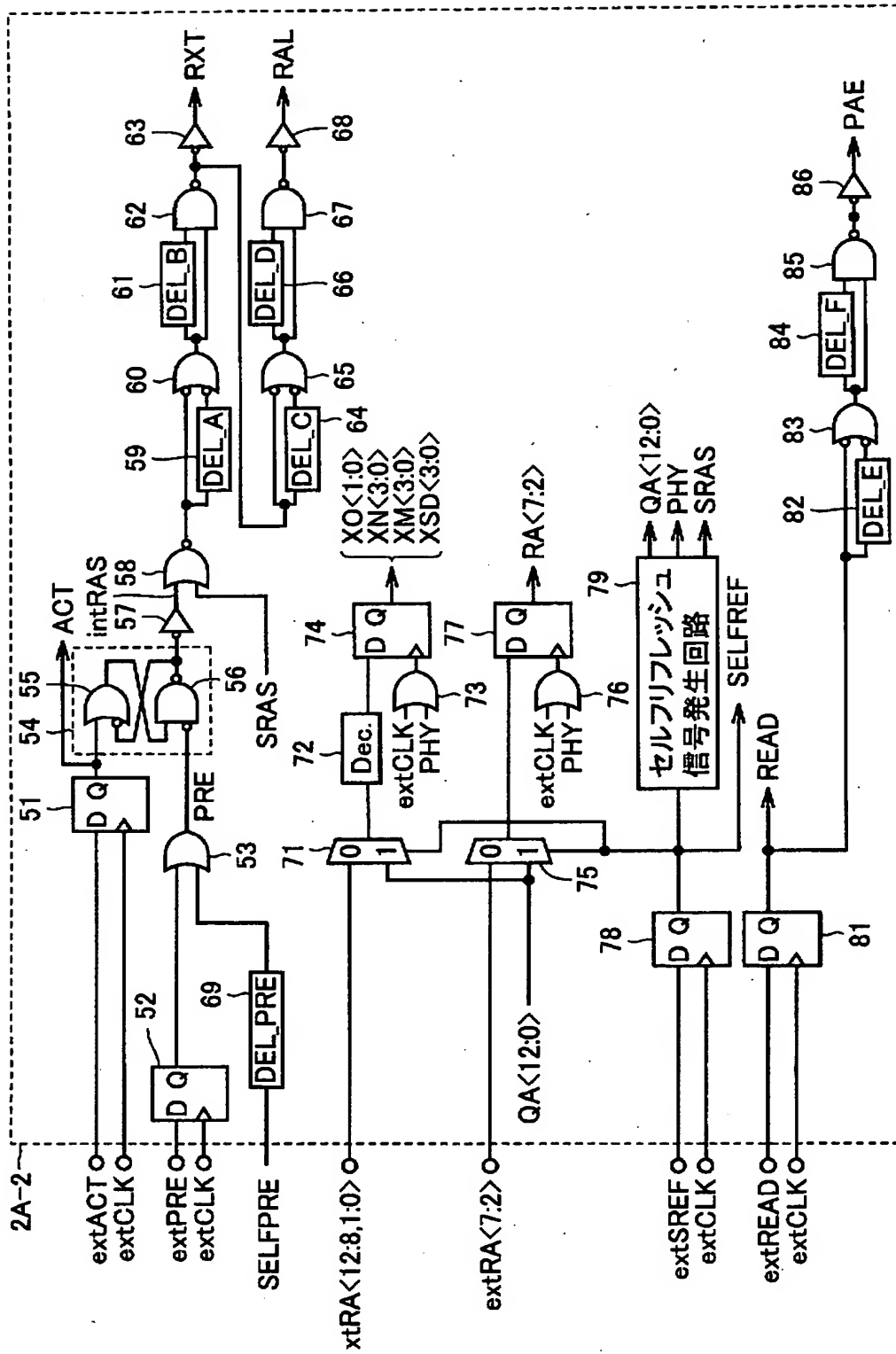
【図 4】



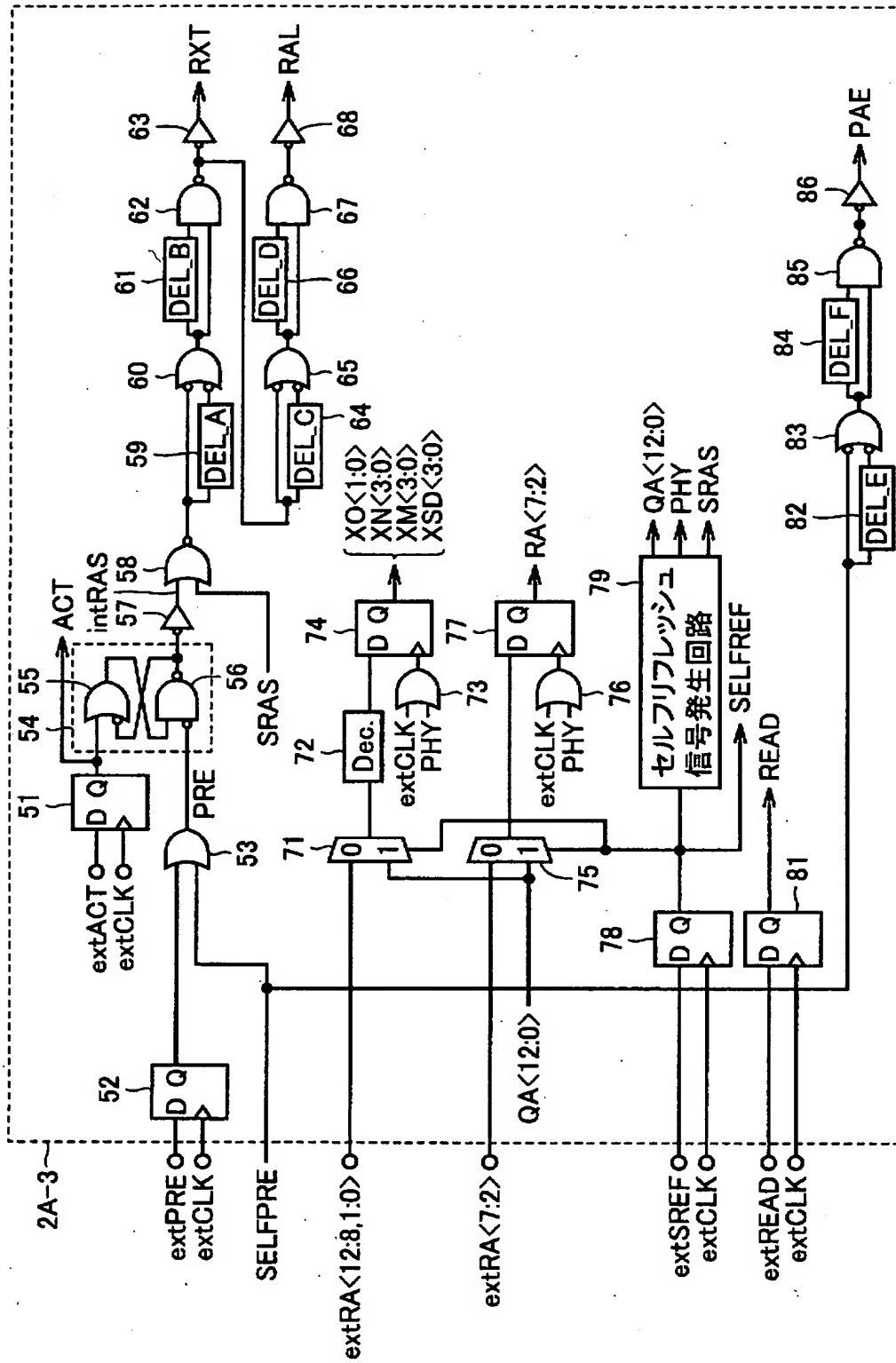
【図 5】



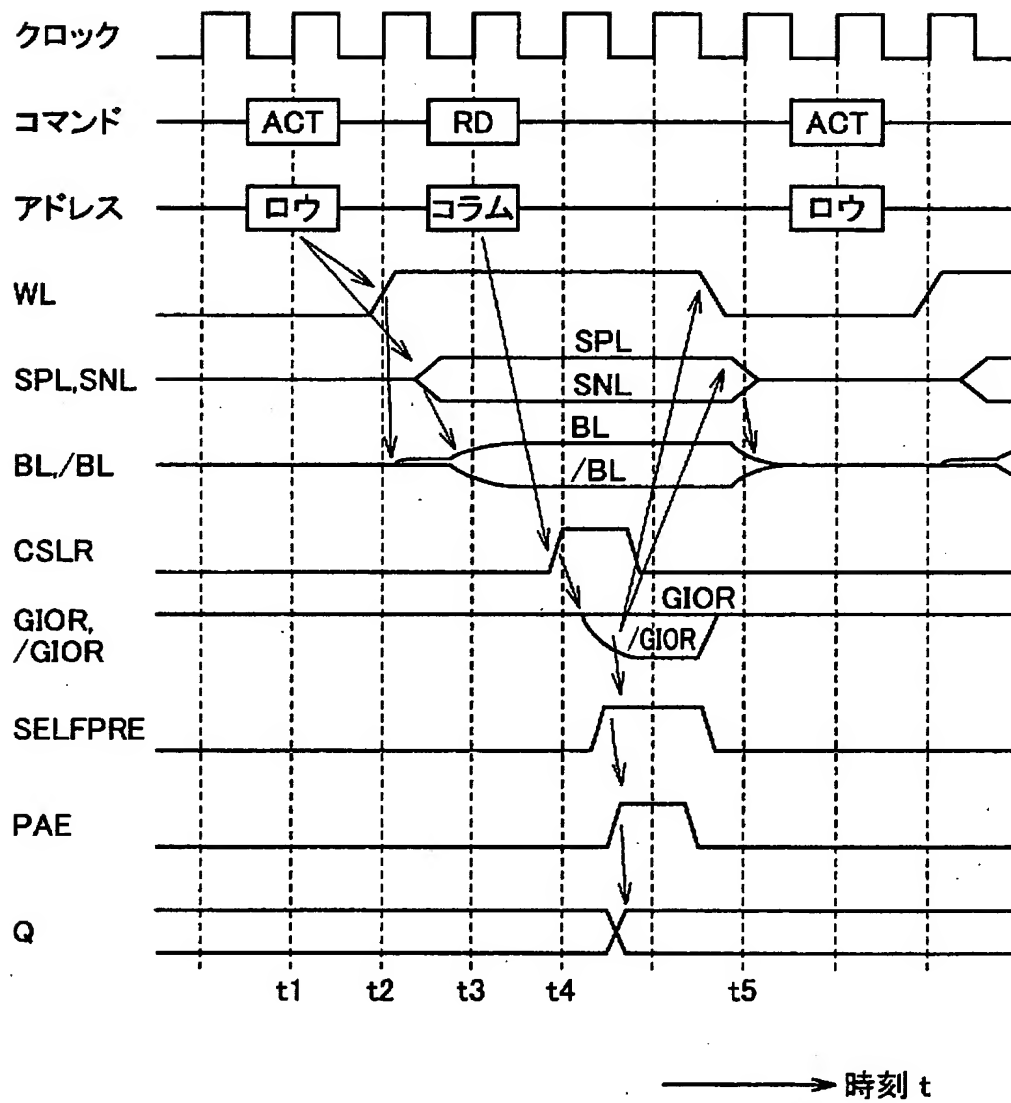
【図 6】



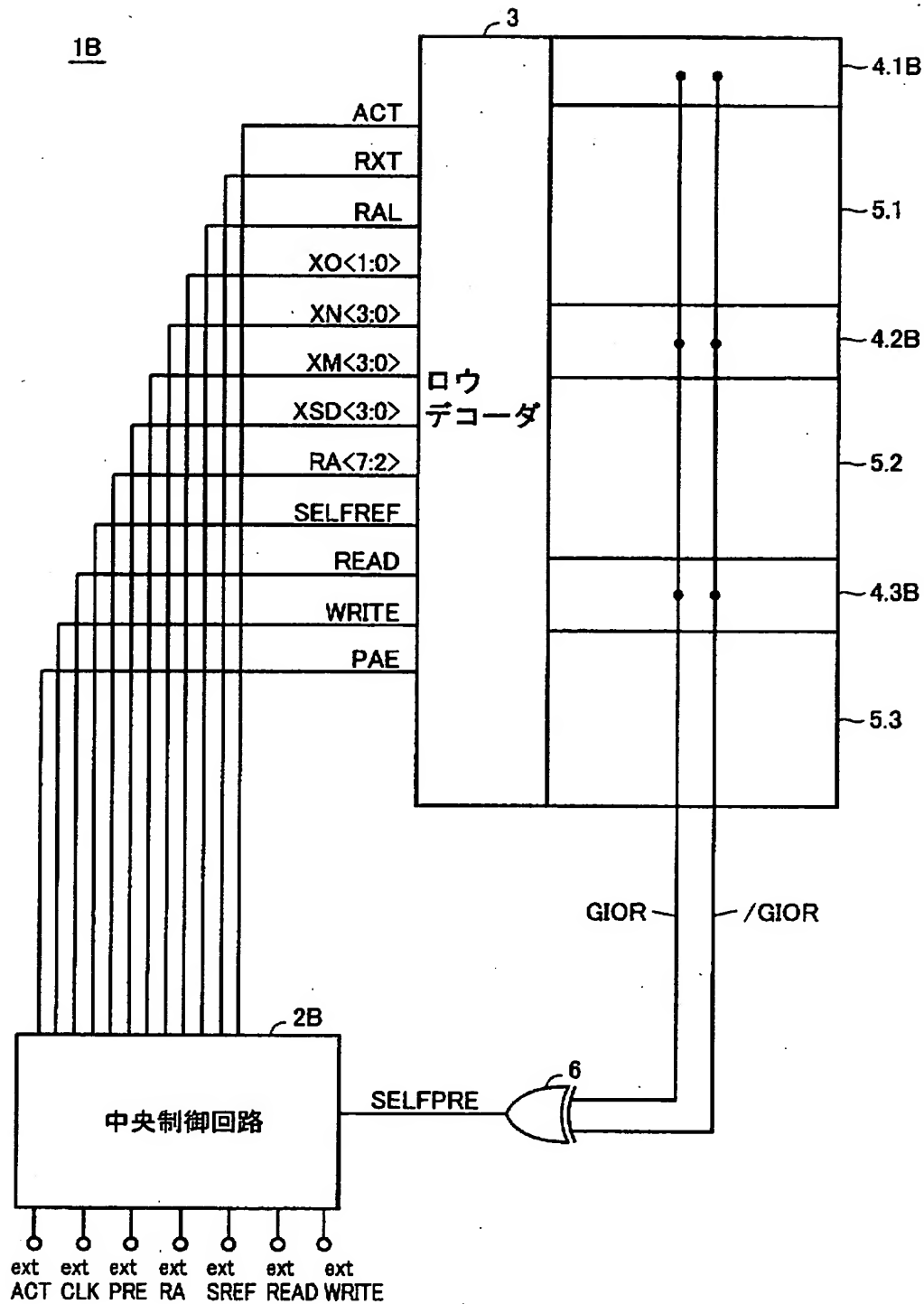
【図 7】



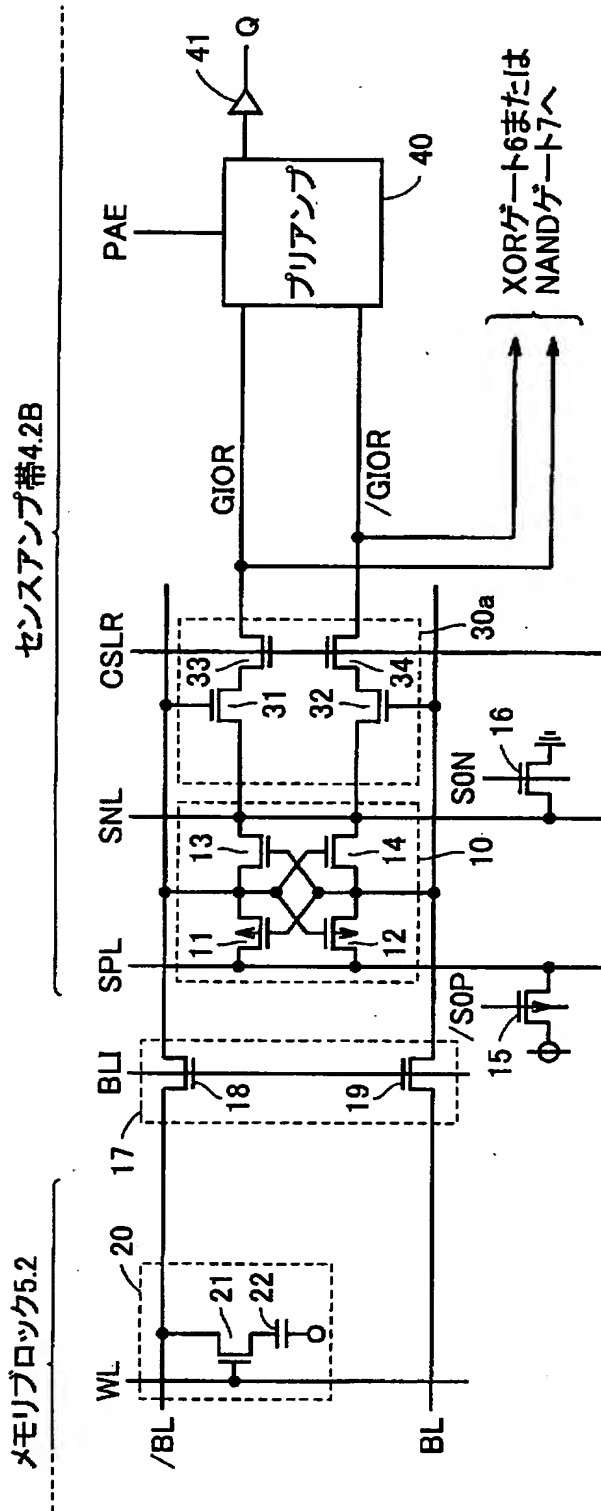
【図 8】



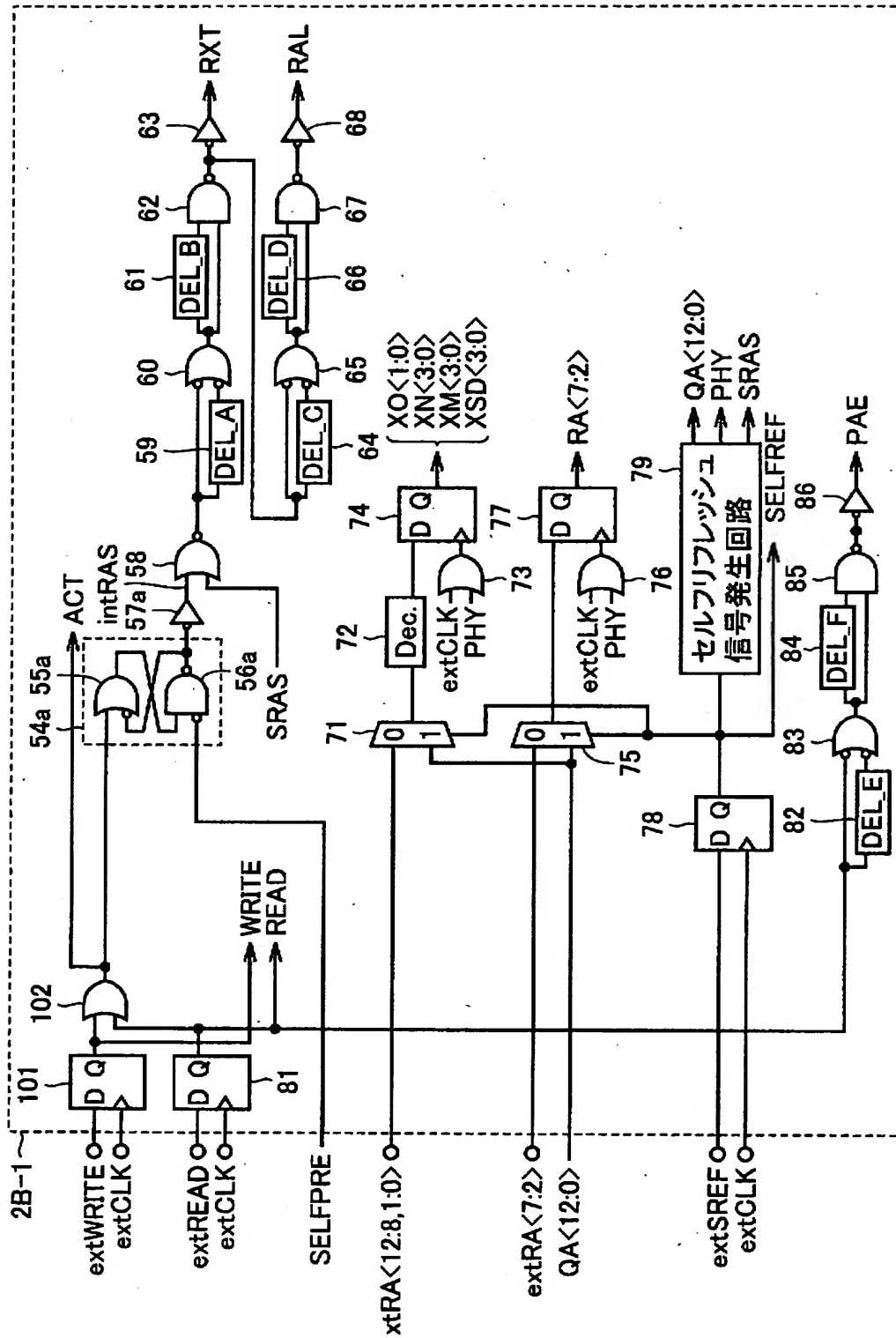
【図 9】



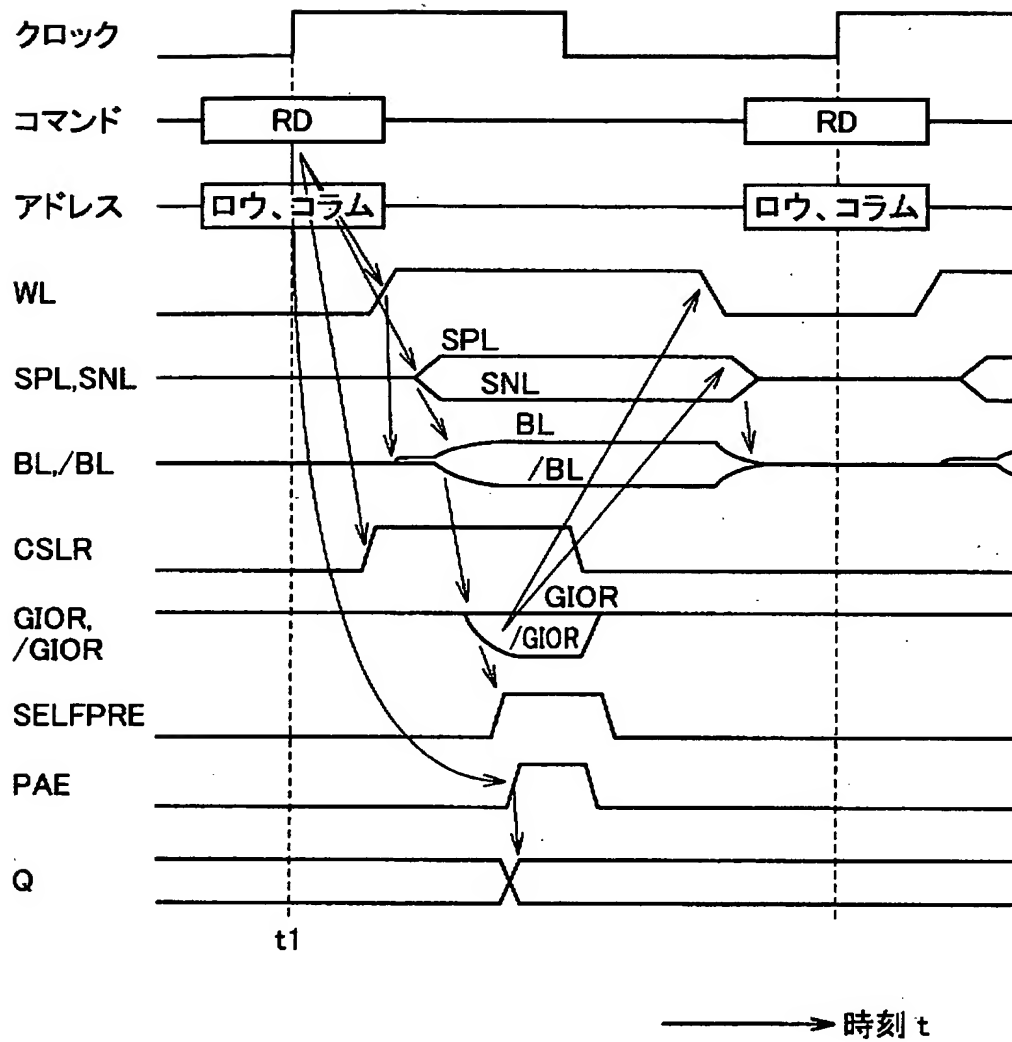
【図 10】



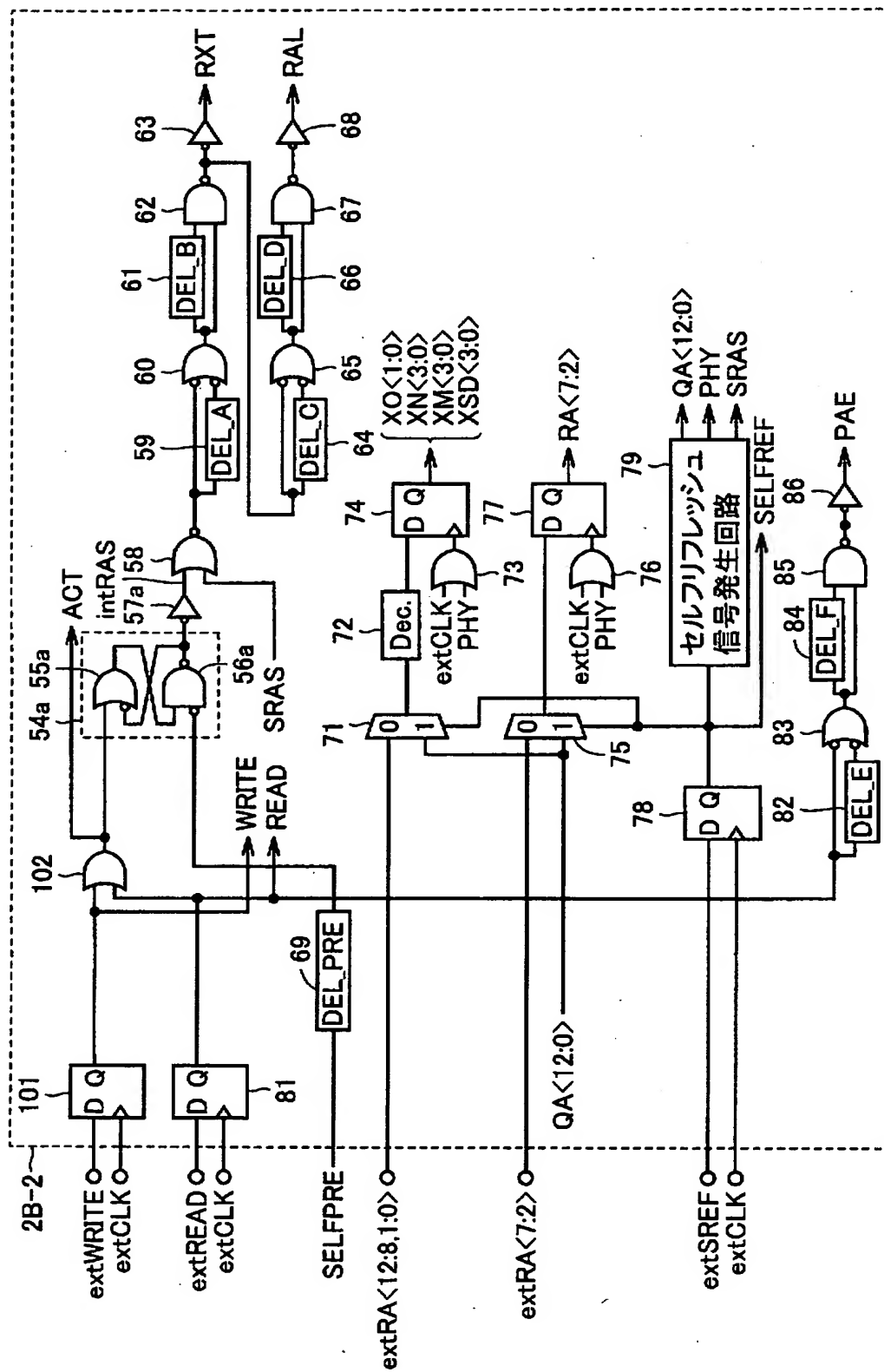
【図 1 1】



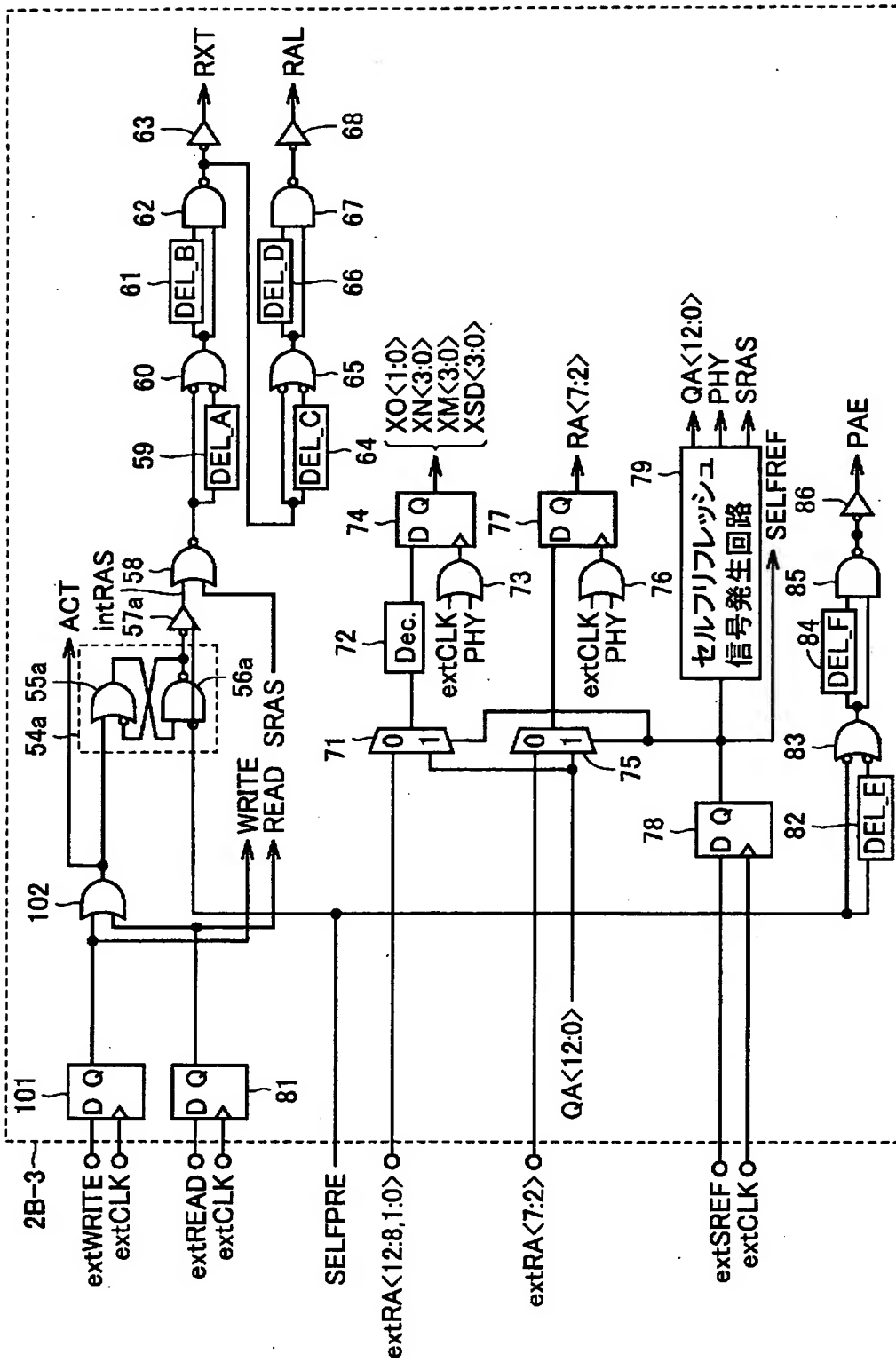
【図 12】



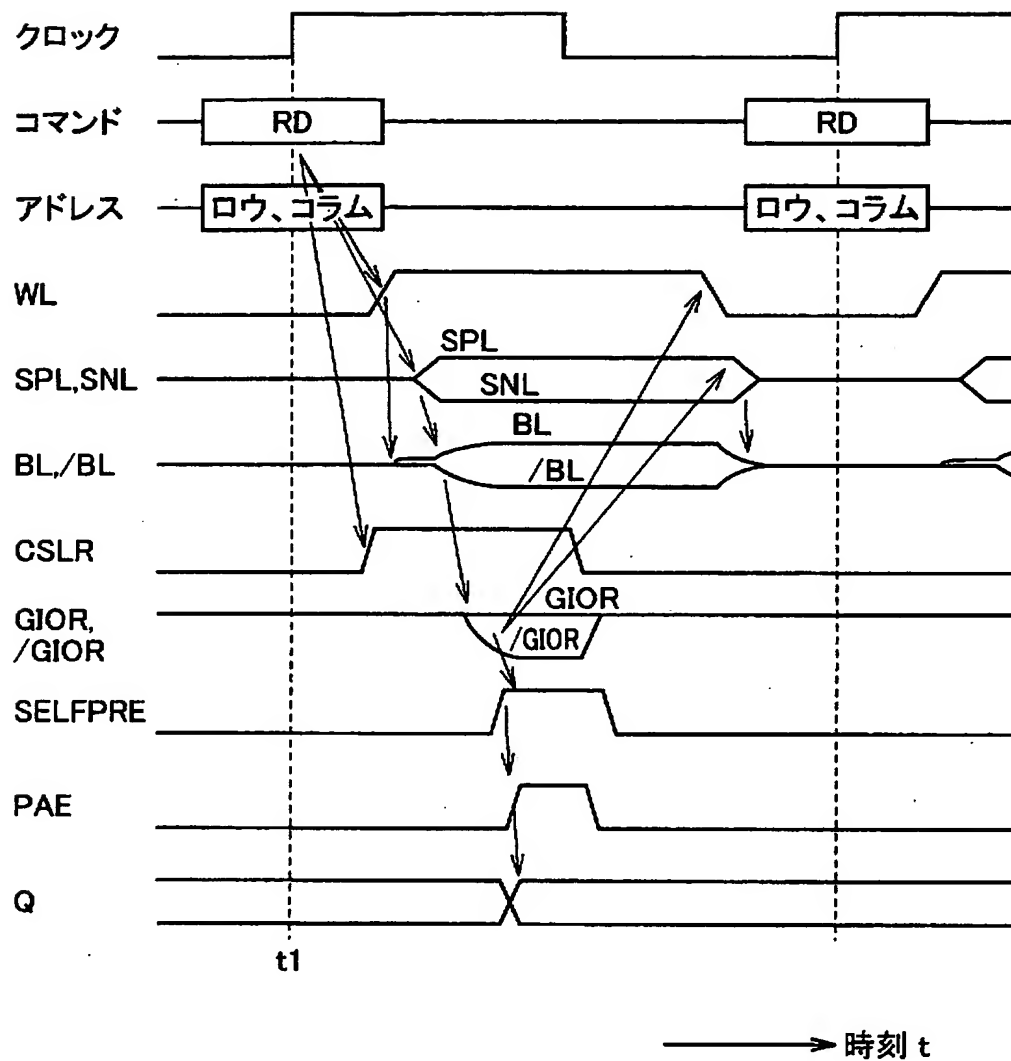
【図 13】



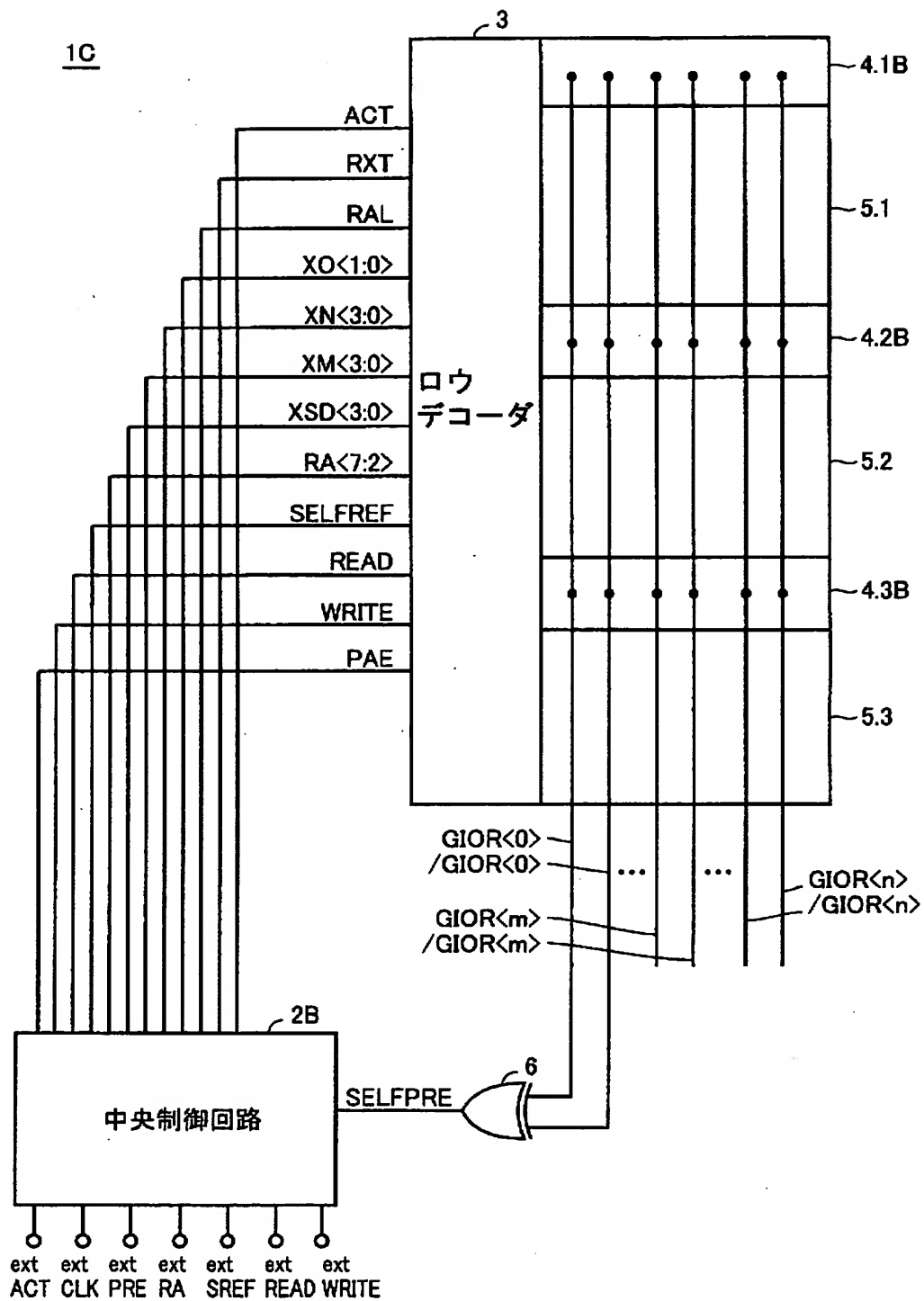
【図 14】



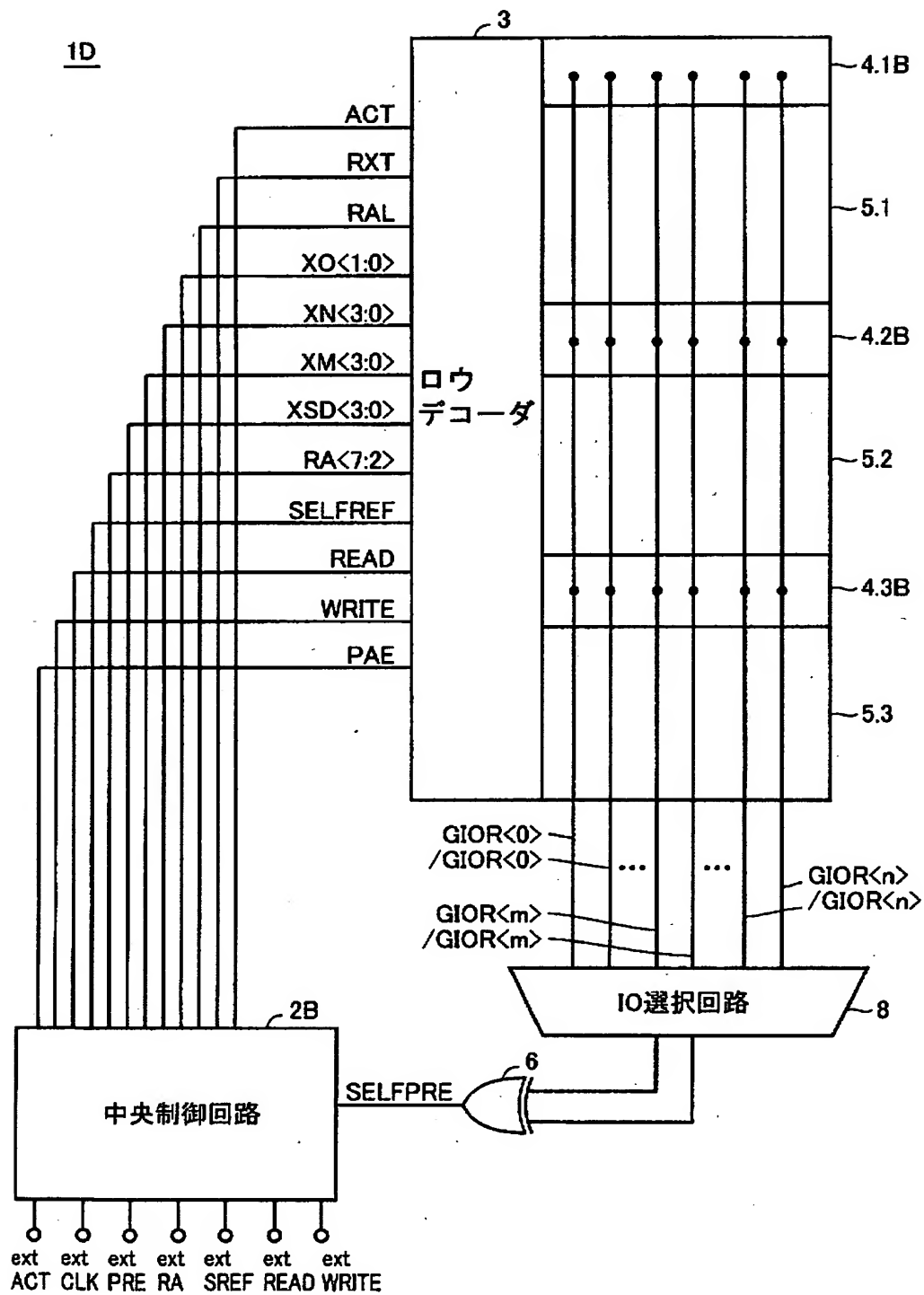
【図 15】



【図 16】



【図 17】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 新たな外部信号線および外部制御を必要とせずにメモリ動作の高速化が可能な半導体記憶装置を提供する。

【解決手段】 X O R ゲート 6 は、読出しデータ線対 G I O R, / G I O R からの入力を受け、読出しデータ線対 G I O R, / G I O R の電位差が開いているときにセルフプリチャージ信号 S E L F P R E を出力する。これにより、R E A D コマンド発行時に読出しデータ線対 G I O R, / G I O R の電位差が開き次第、自己整合的にプリチャージ動作が実行される。ゆえに、R E A D コマンド発行時に外部からのプリチャージコマンドが不要となり、かつ高速化が容易となる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006013]

1. 変更年月日	1990年 8月24日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号
氏 名	三菱電機株式会社